Vom Gerätetest zum IC-Test System

Kurzbeschreibung

Die Untersuchung der Störfestigkeit auf IC-Niveau hat den Vorteil, dass die Einflüsse des Gerätedesigns auf die EMV, beispielsweise die Gestaltung des Leiterplattenlayouts, die Art und Belegung der Steckverbinder oder die Gehäusekonstruktion nicht betrachtet werden müssen. Auch sind bei direkten IC- Störfestigkeitstests die parasitären Effekte weniger ausgeprägt als bei einem Gerätetest. Daraus ergibt sich eine bessere Reproduzierbarkeit der Testergebnisse. Die vorliegende Schrift soll den Zusammenhang zwischen Gerätetest und Pin-granularem IC-Test nachweisen.